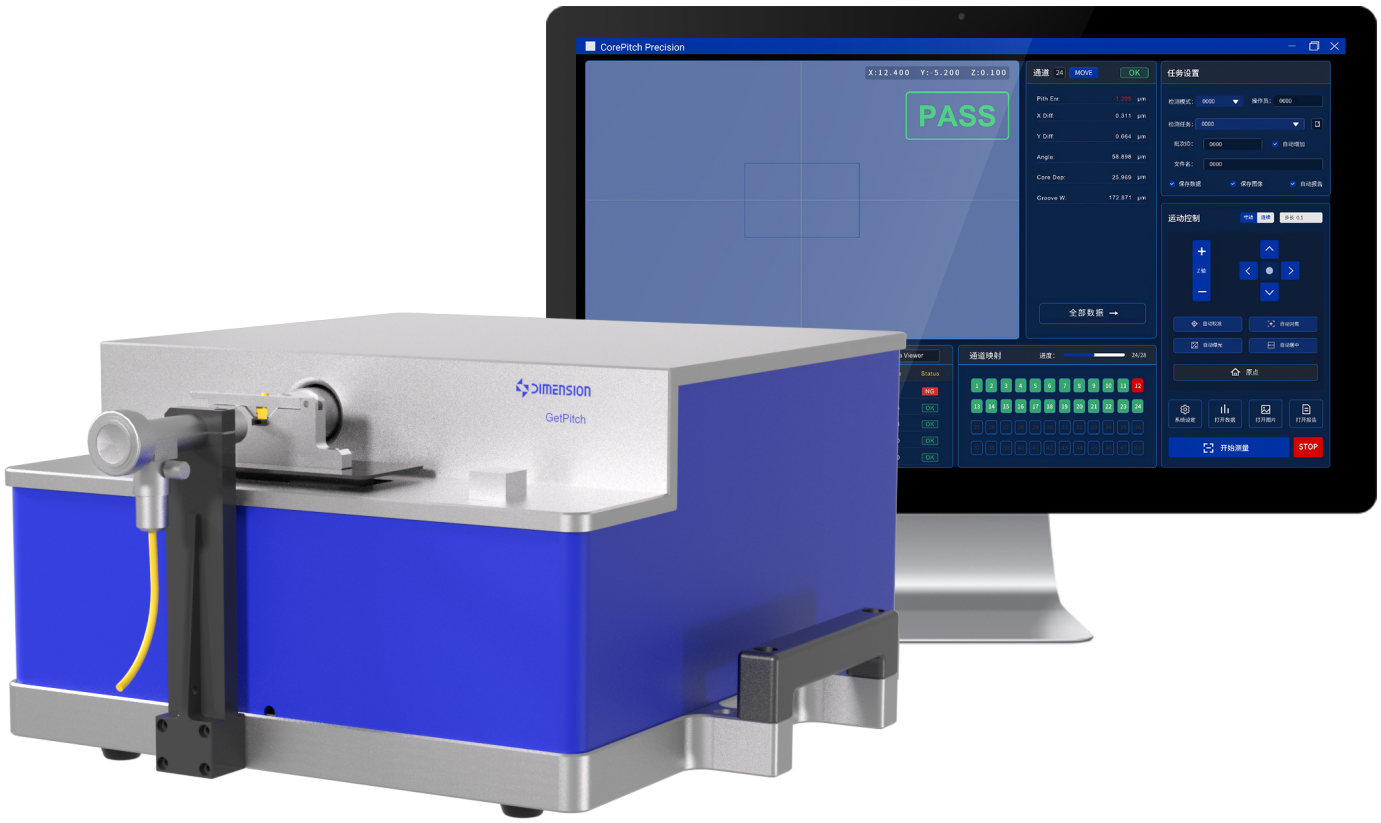
# GET Pitch
# 纤芯距智能测试仪




随着 AI 算力集群与 800G/1.6T 高速光网络的爆发，光通信正加速向“超高密度多芯互联”演进。为了满足极端的超低插损要求，多通道光纤阵列 (FA) 与高密度 MT 插芯的端面几何公差被极度压缩，物理尺寸的绝对精度已成为决定无源器件厂商良率与核心竞争力的生命线。Getpitch系列是由维度科技自主研发的全新一代超高精度光学组件几何尺寸量测终端，该设备旨在打破传统实验室级大型干涉仪“体积庞大、价格高昂、测试节拍冗长”的局限，将 0.01 μm 级的微观几何量测能力无缝下放至高速量产车间。本设备专为突破亚微米级形位公差瓶颈而生，为全球顶尖的无源光器件制造商与光模块来料检验部门，提供兼顾“绝对精度”与“单件极速流”的标准化产线级解决方案。

## 主要优势

- 支持多种器件测试
- 成像稳定清晰
- 软件直观操作简单
- 数据一键保存

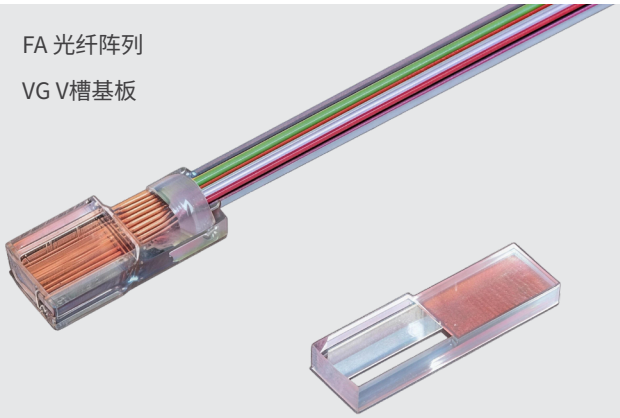
## 主要应用

- 多通道 FA 光纤阵列测量
- V槽基板测量
- 高密度 MT 插芯

## 应用范围广，FA/MT/VG 覆盖

打破单一器件量测壁垒，一机搞定无源器件全产业链核心物理尺寸。通过更换不同夹具，实现从硅光 V 槽基板的绝对槽深与角度，到多通道 FA 光纤阵列的芯间距，再到超高密度 MT 插芯的导向孔偏移，实现多品类、全场景的亚微米级几何特征提取，最大化设备利用率。

- FA 光纤阵列
- VG V槽基板

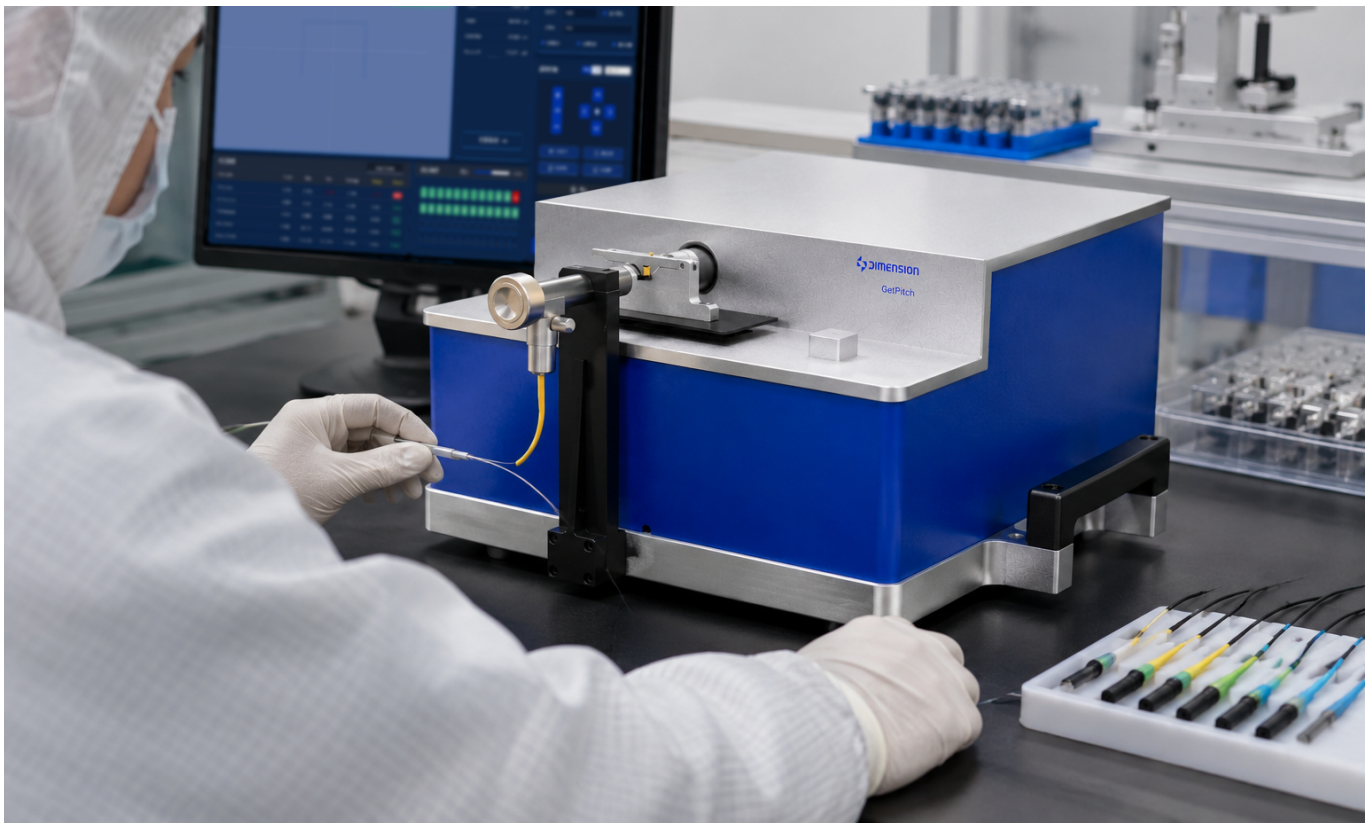


- MT
- MT 光纤组件
- MPO 多芯光纤连接器



## 测量精度高

告别传统纯视觉估算误差。底层硬件搭载纳米级工业激光尺，实现 X/Y 轴绝对闭环位置反馈。配合千万级像素相机，将系统测量精度推进至 0.01μm，实测重复性指标严控在 3δ≤0.1μm，达到业内顶级计量水准。

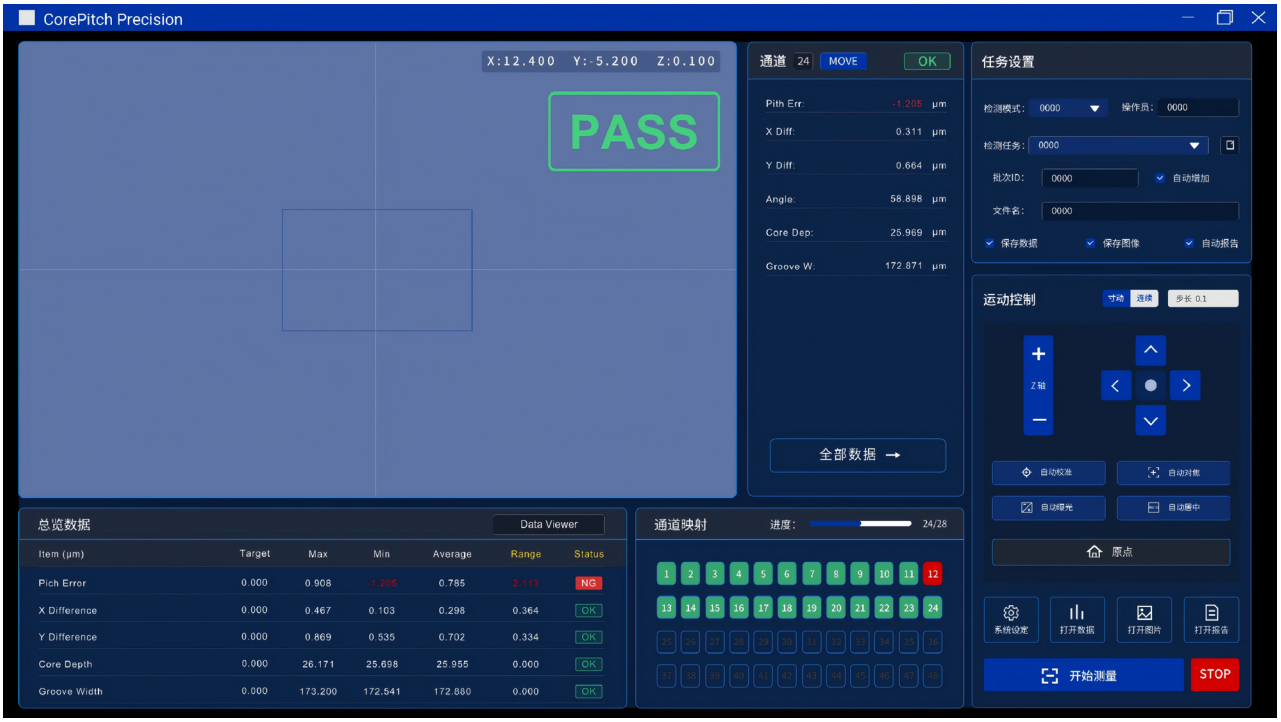


## 软件界面直观，操作难度低

我们深知测量设备的专业性不仅在于硬件，更在于数据呈现的效率。

**操作隔离：** 实时测量数据界面与制程统计界面 (SPC) 物理分离。操作员专注于实时监控，品质工程师则可通过独立面板进行 CPK、极差等制程能力分析，互不干扰。

**高密度信息层：** 摒弃华而不实的视觉特效，采用高对比度、工业深色背景的严谨 UI 设计，长时间作业不易疲劳，核心坐标、判定结果 (Pass/Fail) 一目了然。




## 产品参数

| 产品型号 | GET Pitch |
|---|---|
| 测试对象 | FA\V槽\MT |
| 镜头 | 20倍物镜 |
| 相机 | 5472*3648像素 |
| 精密移动平台 | X轴行程：±5mm<br>Y轴行程：±5mm<br>对焦轴行程：±2mm |
| 对焦方式 | Auto |
| 对焦时间 | <3s |
| 测量分辨率 | 0.001微米 |
| 测量重复精度 | 3σ≦0.1 微米(测试10次) |
| PC | window 10 |


深圳市维度科技股份有限公司
电话:+86 755-26480850
邮箱:sales@dimension-tech.com
网站:www.dimension-tech.com